



سنتز نانوالیاف SiC به صورت درجا به منظور افزایش مقاومت به اکسیداسیون گرافیت

جلیل پوراسد* و ناصر احسانی

مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩٤/١١/٢٥، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٩٥/٢٢/١، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٩٥/٥٣/٢٠

چکیدہ

در این تحقیق از مزایای فناوری نانو برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون گرافیت استفاده شده است. پوشش اولیه به روش سمانتاسیون بستهای و پوشش ثانویه به روش روکش دوغابی در دمای C^o ۱۶۰۰ و زمان ۲ ساعت، بر گرافیت اعمال شده و آزمون اکسیداسیون نمونه ها در دمای C^o ۱۵۰۰ انجام گرفت. شناسایی فازی پوشش ها در حالت قبل و بعد از اکسیداسیون، با دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد و از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ریزساختار پوشش ها استفاده شده و نرمافزار HSC Chemistry پراش اشعه ایکس (SEM) انجام شد و از گیبس واکنش ها بکار رفت. نتایج نشان داد که روش سمانتاسیون بستهای منجر به تشکیل پوشش متراکم و تدریجی با فاز غالب β-SiC می شود. همچنین نانوالیاف SIC با ابعاد حدود nm -۰۰۰ به صورت درجا تشکیل شد که تاثیر بسزایی در مقاومت به اکسیداسیون پوشش ها دارند، به طوری که با اکسید کامل گرافیت در یک ساعت اول، کاهش وزن نمونه حاوی نانوالیاف SiC پس از ۱۰ ساعت تنها ۶ درصد بود.

واژههای کلیدی: نانوالیاف SiC، گرافیت، اکسیداسیون، هدفمند تدریجی، سمانتاسیون بسته ای، روکش دوغابی.

۱- مقدمه

امروزه استفاده از گرافیت به دلیل حفظ خواص حرارتی و مکانیکی در دمای بالا گسترش یافته است. با این حال مشکل اصلی آنها، شروع اکسیداسیون از دمای C^o ۴۰۰ در محیط اکسیدی می باشد، به طوری که طول عمر قطعه کربنی در دمای C^o ۵۰۰ در محیط غیراکسیدی در حدود ۴۰۰

ساعت می باشد، در حالی که طول عمر آن در شرایط اکسیدی کمتر از یک ساعت است. البته نشان داده شده است که اکسیداسیون گرافیت در دماهای مختلف با مکانیزمهای مختلفی کنترل می شود، در دماهای کمتر از ۵° ۶۰۰ مکانیزم واکنش شیمیایی غالب است، در محدوده دمای ۵° ۹۰۰–۶۰۰ مکانیزم غالب، نفوذ اکسیژن در حفرات بوده و در دمای بیش از ۵° ۹۰۰ مکانیزم لایه مرزدانه

^{*}**عهدەدار مكاتبات:** جليل پوراسد

نشانی: تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت

تلفن: ۲۱۰-۲۲۹۵۲۲۸۶، دورنگار: ۲۲۹۵۲۲۸۶، پست الکترونیکی: jpourasad@gmail.com

كنترل كننده اكسيداسيون مي باشد. بدين ترتيب با افزايش دمای اکسیداسیون، سرعت واکنش شیمیایی گرافیت با اکسیژن، به شدت افزایش یافته و میزان اکسیداسیون نیز بيشتر مى شود [۳–۱]. بهترين روش براى تقويت مقاومت بـه اکسیداسیون گرافیت برای دماهای کاربرد بیش از C° ۱۰۰۰ استفاده از کاربید سیلیسیم است که دارای مزایای زیادی جهت استفاده در دماهای بالا می باشد. به طوری که کاربید سیلسیم تا دمای C° ۲۷۰۰ در اتمسفر خنثی پایدار است و در اتمسفر اكسيدى، با ايجاد لايه محافظ، لايه تا حد قابل توجهی از نفوذ اکسیژن به درون زمینه کربنی جلوگیری مي كند. با اين حال طي افزايش دما و زمان اكسيداسيون، به دليل ناهمخواني ضريب انبساط حرارتي بين پوشش SiC و گرافیت، منافذی برای نفوذ اکسیژن به زیرلایه کربنی ایجاد شده و منجر به شکست پوشش میشود [۴،۵]. یکی از روش های حل این مسئله، استفاده از پوشش های نانوساختاری می باشد، به طوری که نشان داده شده است پوشش نانوساختار SiC پیوند بین لایه ها در فصل مشتر ک را تقويت كرده و با بهبود چقرمگي، نقش مهمي را در توقف ريز تر کها در يوشش و افزايش مقاومت به اکسيداسيون ايفا

افزودن نانوذرات SiC توسط محققین انجام شده است، به طوری که Li[۶] و جعفری [۸]، با افزودن نانوذرات SiC در ترکیب سمانتاسیون بستهای (Pack cementation) بر پوشش کامپوزیت کربن-کربن و گرافیت، نشان دادند که نانوذرات SiC چقرمگی پوشش سرامیکی SiC را افزایش و تنش در پوشش را کاهش می دهند، در نتیجه قابلیت حفاظت پوشش در برابر اکسیداسیون را تقویت می کنند. همچنین Chl [۹] و همکارانش پوشش چند لایه SiC و نانوسیم SiC را به روش ترکیبی رسوب بخار فاز شیمیایی (CVD) بر کامپوزیت Sic کربن-کربن اعمال کردند و نشان دادند که نانووایر Sic پیوند بین لایه های داخلی و بیرونی را تقویت کرده و چقرمگی لایه بیرونی را بهبود می بخشد، در نتیجه نقش

بدین ترتیب با توجه به اینکه سنتز درجا نانوالیاف SiC به روش سمانتاسیون بستهای و رو کیش دوغابی (Slurry painting) برای تقویت مقاومت به اکسیداسیون گرافیت انجام نشده است، تحقیق حاضر به آن می پردازد. در روش سمانتاسیون بستهای، قطعات گرافیتی در مخلوطی از پودرهای سیلیسیم، کاربید سیلیسیم، آلومینا و گرافیت با پودرهای سیلیسیم، کاربید سیلیسیم، آلومینا و گرافیت با ترکیب معین قرار گرفته و در محیط خنثی و دمای مناسب، حرارت داده می شود تا با واکنش Sl و C، لایهای از SiC بر راحتی صورت پذیرد. روش سمنتاسیون تودهای در مقایسه با سایر روش ها، دارای مزایایی نظیر هزینه کمتر، سهولت سایر روش ها، دارای مزایایی نظیر هزینه کمتر، سهول مواد کربنی، قابلیت صنعتی سازی، دستیابی به دستگاهها و مواد در داخل کشور و ایجاد لایههای مختلف در یک فرآیند با ماهیت هدفمندی و تدریجی می باشد [۱۰،۱۱].

۲- فعالیتهای تجربی

۲-۱- مواد اوليه

مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق، شامل پودر سیلیسیم با خلوص بیش از ۹۹٪ و ابعاد کمتر از ۱۵ میکرون ساخت شرکت پانادین (Panadyne) برای تشکیل لایه تدریجی کاربید سیلیسیم در گرافیت پایه، پودر کاربید سیلیسیم (Codfellow) با خلوص بیش از ۹۹٪ و ابعاد کمتر از ۱۰ میکرون ساخت شرکت گودفلو (Goodfellow)، پودر آلومینا ساخت شرکت گودفلو (Goodfellow)، پودر آلومینا میکرون از شرکت پانادین برای تشکیل فازهای گازی SiO و (یرکونیم (ZrB2) با خلوص بیش از ۹۹٪ ابعاد کمتر از ۱۰ زیرکونیم (ZrB2) با خلوص بیش از ۹۹٪ ابعاد کمتر از ۱۰ میکرون ساخت شرکت اچ سی استرک (H.C.Strack) برای تشکیل فاز سیلیکات زیر کونیم می باشد. همچنین در این پروژه از پلی کربوسیلان (PCS) تولید شرکت الیاف سرامیکی از پلی کربوسیلان (Suzhou CeraFil Ceramic Fibers) چین با

R

مي کنند [۴،۶،۷].

متوسط وزن مولکولی امی ۱۵۰۰ میلی ۱۵۰۰ میلی د. ۱۰۰۰ میلی ذوب ۲۲۰ ۲۷۰ میلی ۱۷۵۰ دانسیته SiC_{1.8}O_{0.3} با باقی مانده مواد سرامیکی بیش از ۵۵٪ و فرمول عمومی SiC_{1.8}O_{0.3} برای تشکیل نانوالیاف SiC استفاده شد. رقیق سازی پلی کربوسیلان با استفاده از محلول زایلن (C₈H₁₀) انجام شد. همچنین برای پر کردن حفرات توسط تر کیب SiO₂ از تترا اتیل پر کردن حفرات روسط تر کیب SiO₂ از شر کت ار توسیلیکات (TEOS) با فرمول Si (Si (C₂H₅O) از شر کت ار توسیلیکات (TEOS) با فرمول Si (Si (C₂H₅O) از شر کت ار تروسیلیکات (Si وافیت پایه از نوع ATJ با دانسیته ظاهری میباشد. قطعات گرافیت پایه از نوع ATJ با دانسیته ظاهری میباشد. قطعات گرافیت پایه از نوع IVV (Sicm میباشد. قطعات گرافیت پایه از نوع IVV می انسیته ظاهری (TF/OS میباشد.

۲-۲- روش اعمال پوشش

ابتدا نمونه هایی به ابعاد ۱×۱×۱ سانتی متر مکعب از قطعات گرافیت بریده شده و پس از آمادهسازی سطح در خشک کن حرارتی به دمای C° ۱۱۰ به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند. پوشش اولیه بر گرافیت به روش سمانتاسیون بستهای انجام شد، بدین ترتیب مخلوط پودری با ترکیب ۵۰ درصد وزنی پودر سیلیسیم، ۴۰ درصد وزنی کاربیـد سیلیسـیم و ۱۰ درصد وزنى آلومينا آماده شد و درون ظرف آببند پلیاتیلنی حاوی گلوله های آلومینایی قرار گرفت و توسط بالمیل به مدت سه ساعت مخلوط شد. قطعات گرافیتی در بسترى از مخلوط پودرها قرار گرفت و بوته حاوى نمونهها، تحت عملیات حرارتی در محیط آر گون قرار گرفت، به طوری که با نرخ متوسط ۱۰ °C/min به دمای C° ۱۴۵۰ رسید و به منظور یکنواخت شدن دمای محفظه و ذوب سیلیسیم [۱۲] به مدت ۱/۵ ساعت در این دما باقی ماند، سپس به دمای C° ۱۶۰۰ رسیده و برای پوششدهی به مـدت ۲ ساعت در این دما قرار گرفت. پوشش ثانویه به روش روکش دوغابی اعمال شد. در ایـن روش، پـودر دی بوریـد زیر کونیم تا ۳۰ درصد وزنے به ۳۰ درصد وزنے پلی کربوسیلان و ۴۰ درصد وزنی زایلن اضافه شده و به مدت نیم ساعت همزده می شود. نمونه های دارای پوشش

اولیه در دوغاب حاصل قرار می گیرد تا به طور کامل به آن آغشته شود. پس از آن نمونه ها در دمای ۲[°] ۱۱۰ خشک می شوند. این کار تا چهار بار انجام می شود و در نهایت خشک کردن نمونه ها در دمای ۲[°] ۱۱۰ به مدت ۲۴ ساعت انجام می شود. نمونه ها با استفاده از کاغذ نسوز پوستی (Parchment paper) آغشته به مخلوط سیلیسیم – سیلیکا سل (Silica sol) با نسبت یک به یک، پیچیده شدند. این نمونه ها پس از قرار گرفتن در بستر کک در کوره عملیات حرارتی قرار گرفتن در بستر کک در کوره عملیات پوشش اولیه در دمای ۲[°] ۱۶۰۰ انجام شد. برای پر کردن حفرات پوشش های حاصل از روش دوغابی، سطح آنها تا چهار مرتبه با محلول تترا اتیل ارتوسیلیکات آغشته شده و خشک می شوند [۱۳].

۲-۳- روش انجام آزمونها

آزمون اکسیداسیون همدمایی (Isothermal oxidation) نمونهها در محیط هوا و درون کوره با المنت کاربید سیلیسیم (SiC) در دمای C° ۱۵۰۰ انجام گرفت. وزن نمونهها در حالت قبل و بعد از اکسیداسیون ثبت شده و درصد تغییر آنها طبق رابطه ۱ محاسبه شد:

$$\Delta W = \frac{m_1 - m_0}{m_0} \times 100 \tag{1}$$

که در آن ΔW، درصد تغییر وزن طی اکسیداسیون، m₀ وزن نمونه پوشش داده شده قبل از اکسیداسیون و m₁، وزن نمونه پوشش داده شده پس از اکسیداسیون است. آنالیز فازی پوشش هاده شده پس از اکسیداسیون است. آنالیز فازی پوشش داده شده پس از اکسیداسیون است. آنالیز فازی پوشش داده شده پس از اکسیداسیون است. آنایز فازی سرائی مانی می از کرمافزار ۲۵۵۷ با تحلیل شناسایی فازی با استفاده از نرمافزار PANalytical B.V با تحلیل طیف پراش بر اساس داده های مرکز بین المللی اطلاعات پراش (ICDD) صورت گرفت. ضمنا آنالیز نیمه کمی بر پایه مقادیر نسبت شدت مرجع (Reference Intensity Ratio)

R

از این واکنش،ها به شکل ذره میباشد [۱۶،۱۷].

$$Si_{(l)} + C \rightarrow SiC$$
 (Y)

$$2Si + CO_{(g)} \rightarrow SiC + SiO_{(g)} \tag{(7)}$$

$$SiO_{(g)} + 2C \rightarrow SiC + CO_{(g)}$$
 (*)

همچنین SiC می تواند از واکنش دو فاز گازی SiO و CO طبق معادله ۵ تشکیل شود که شرط آن وجود C در سیستم است تا CO₂ حاصل طبق معادله ۶ به CO تبدیل شود و واکنش SiO و CO به سمت تشکیل SiC پیشرفت کند. در ایسن صورت SiC می توانسد به صورت نانوالیاف (Nanofibers) تشکیل شود [۷].

$$SiO_{(g)} + 3CO_{(g)} \rightarrow SiC + 2CO_{2(g)}$$
 (Δ)

$$2\mathrm{CO}_{2(g)} + 2\mathrm{C} \rightarrow 4\mathrm{CO}_{(g)} \tag{9}$$

فاز اصلی پوشش ثانویه فاز SiC و فازهای جزئی شامل C، SiO₂ و ZrO₂ میباشد. تبدیل ماده اولیه ZrB₂ به فاز ZrO₂ میتواند به دلیل واکنش ZrB₂ با اکسیژن باقیمانده در محیط کوره مطابق معادله ۷ باشد.

$$ZrB_2 + 2.5O_{2(g)} \rightarrow ZrO_2 + B_2O_3 \tag{V}$$

مقایسه انرژی آزاد گیبس واکنش ZrB₂ و C با اکسیژن طبق شکل ۲ نشان میدهد که میل ترکیب ZrB₂ با اکسیژن و اکسیداسیون آن بیش از ترکیب کربن با اکسیژن است، در نتیجه واکنش تشکیل ZrO₂ زودتر انجام شده و اکسیژن باقیمانده به جای تشکیل گاز CO سبب اکسیداسیون ZrB₂ میشود. همچنین فاز B₂O₃ حاصل از اکسیداسیون ZrB₂ از دمای حدود C^o ۴۵۰ کاملا مذاب بوده و میتواند با جریان ناشی از گرانش (Gravity-induced flow) به خلل و فرج که توسط Chung [۱۴] ارائه شده است، محاسبه شد. برای بررسی ریزساختار پوشش، نمونه ها در جهت عمود بر وجه پوشش داده شده، برش خورده و از سطح مقطع در مانت گرم قرار گرفت. سپس سطح آنها به صورت خشک با سنباده های کاغذی از جنس کاربید سیلیسیم صیقل داده شده و با طلا پوشش داده شدند. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM, Tescan, VegaIII) و نیز نوع نشر میدانی بررسی مورفولوژی سطحی و ضخامت پوشش استفاده شد. برای محاسبات ترمودینامیکی نظیر تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش ها از نرمافزار SEM, Tescan انیر فاع داد شرکت تحقیقاتی اوتو کومپو (Suma Research) استفاده شد. در این نرمافزار از روش حداقل انرژی آزاد گیبس برای تعیین ترکیب تعادلی استفاده میشود [۱۵].

۳- نتايج و بحث

۳-۱- آنالیز فازی پوششها

شکل ۱ الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) پوشش اولیه و ثانویه را نشان می دهد. فاز اصلی پوشش اولیه، ترکیب β-SiC با ساختار مکعبی می باشد که مطالعات دیگران نیز موید آن است [۱۶،۱۷]. همچنین فاز گرافیت با ساختار هگزاگونال و فاز SiC-۵ به مقدار کم در کنار فاز اصلی Sic کونال و فاز SiC-۵ به مقدار کم در کنار فاز اصلی ای 2 (معادله ۲)، واکنش Si با CO حاصل از احیای Sic توسط C (معادله ۳) و واکنش C با SiC حاصل از احیای توسط S (معادله ۴) تشکیل می شود. فاز Sic حاصل





شکل ۲: تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش 2rB2 و C با اکسیژن در فشار استاندارد.

پوشش نفوذکند و یا به پایین بسته پودری منتقل شود. همچنین به دلیل فشار بخار بالا، ممکن است تبخیر شود، در نتیجه فاز B₂O₃ طی آنالیز فازی سطح پوشش مشاهده نمی شود [۷].

فازهای SiC و SiO₂ موجود در پوشش ثانویه می تواند از پلی کربوسیلان و مقداری تترا اتیل ارتوسیلیکات حاصل شود. تغییرات فازی پلی کربوسیلان در دمای بیش از C^o ۱۰۰۰ می تواند طبق معادله ۸ و معادله ۹ انجام گیرد [۱۸]:

$$\operatorname{SiC}_{x}\operatorname{O}_{y} \rightarrow \operatorname{SiC} + \operatorname{SiO}_{(g)} + \operatorname{CO}_{(g)} + \operatorname{C}$$
 (A)

$$\operatorname{SiO}_{(g)} + 3\operatorname{CO}_{(g)} \rightarrow \operatorname{SiC} + 2\operatorname{CO}_{2(g)} \tag{4}$$

بدین ترتیب با عملیات حرارتی پوشش ثانویه که حاوی پلی کربوسیلان و دیبورید زیر کونیم هستند، فازهای SiC، (g) SiO(g) و C می تواند تشکیل شوند که نتایج پراش اشعه ایکس نیز حاکی از حضور SiC است اما نکته مهم تر آن است که واکنش فازهای (g) SiO و (g) CO می تواند نانوالیاف SiC تشکیل دهد. از طرفی دیگر طبق معادله ۱۱ و معادله ۱۱ فاز SiO می تواند

 $Si(OC_2H_5)_{(1)}+4H_2O_{(1)}\rightarrow Si(OH)_{4(1)}+4C_2H_5OH_{(1)}(1.)$

از تترا اتیل ارتوسیلیکات از دمای C° ۱۵۰ حاصل شود [۱۳]:

$$Si(OH)_{4(l)} \rightarrow SiO_2 + 2H_2O_{(l)} \tag{11}$$

۲-۲- بررسی ریزساختار پوششها

شکل ۳ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) پوشش ها را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود هر دو پوشــــش، دارای ماهیـــت هدفمنـــد تـــدریجی (Functionally graded) بـوده و فاقـد تـرک عمـودی (Transverse crack) هستند و هیچ فصل مشترک مشخصی بین گرافیت اولیه و پوشش SiC حاصل مشاهده نمی شود [۱۹].

در شکل ۴ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش ها نشان داده شده است. همانطور که مشاهده



شکل ۳: تصاویر SEM سطح مقطع پوشش.

همانطور که بیان شد، SiC حاصل از واکنش دو فاز گازی SiO و CO طبق معادله ۱۲ اغلب به صورت نانوالیاف تشکیل میشود [۷]. با توجه به اینکه پوشش ثانویه در محافظت با کاغذ آغشته به سیلیسیم و در بستر کک در کوره قرار گرفت، به نظر میرسد گازهایSiO و CO توسط غلاف سیلیسیمی محصور شده و با افزایش فشار بخار آنها، نانوالیاف SiC به صورت درجا (In situ) تشکیل میشود.

$$\operatorname{SiO}_{(g)} + 3\operatorname{CO}_{(g)} \rightarrow \operatorname{SiC} + 2\operatorname{CO}_{2(g)} \tag{11}$$

۳-۳- مقاومت به اکسیداسیون پوششها

جدول ۱ تغییرات وزنی نمونه ها را پس از اکسیداسیون همدمایی در دمای ۲^o ۱۵۰۰ نشان می دهد. پس از آزمون اکسیداسیون، گرافیت پایه بدون پوشش در زمان حدود یک ساعت اکسید شد، در حالی که نمونه با پوشش اولیه تا حدود ۳۸٪ کاهش وزن داشت و از آن پوسته با کمی هسته گرافیتی باقی ماند. اما نمونه با پوشش ثانویه حاوی نانوالیاف SiC از دوام مناسبی بر خوردار بود و تنها حدود ۶٪ کاهش وزن داشت که نشان می دهد تشکیل نانوالیاف SiC اثر بسزایی بر مقاومت اکسیداسیون دارد. به طور کلی می توان پوشش اولیه واکنش شیمیایی کربن با اکسیژن بوده و اکسیداسیون پوشش ثانویه با سرعت نفوذ اکسیژن از درون عیوب پوشش به پایه گرافیتی کنترل می شود [۲۱].

در شکل ۵ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش ها پس اکسیداسیون در دمای C° ۱۵۰۰ به مدت

جدول ۱: درصد تغییرات وزن نمونهها پس از ۱کسیداسیون در دمای ۲° ۱۵۰۰.

يون (ساعت)	زمان اکسیداس	نوع نمونه	
۱۰ ساعت	يک ساعت		
_	<u>'</u> .۹۸/۱	گرافیت بدون پوشش (نمونه شاهد)	
·/.٣٧/٩	'/.Y/V	گرافیت حاوی پوشش اولیه	
'/. ? /Y	۲ <u>٬۰</u> /۳	گرافیت حاوی پوشش ثانویه	



شکل ٤: تصویر SEM سطح پوشش،ها با نمایش ابعاد نانوالیاف SiC.

می شود هر دو پوشش دارای نانوساختارهای تک بعدی هستند که بنابر نتیجه آنالیز تفکیک (EDS) نقطهای دارای ترکیب SiC می باشد که طبق استاندارد 80004-41SO/TS [۲۰] به عنوان نانوالیاف شناخته می شود. نانوالیاف SiC دارای قطر زیر ۱۰۰ می باشد و در مواردی به حدود دارای قطر زیر ۱۰۰ می باشد و در مواردی به حدود یه ۱۰ هم رسیده است و طول آنها متغیر بوده و در مواردی به ۱۰ میکرون هم می رسد. ضمن آن که فراوانی نانوالیاف SiC در پوشش ثانویه بیشتر است که قطر نانوالیاف SiC آن در حدود ۲۰۰ می باشد.

22



شکل ۲: SEM سطح پوششها پس از اکسیداسیون به مدت ۱۰ h.

۱۰ ساعت نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود نمونه پوشش اولیه نسبت به پوشش ثانویه دارای خلل و فرج بیشتری است، البته سطح پوشش ثانویه با فاز شیشهای پر شده است. به نظر می رسد رابطه مستقیمی بین میزان خلل و فرج و درصد کاهش وزن برقرار است. به طوری که هر چه سطح دارای خلل و فرج بیشتری باشد، نفوذ اکسیژن به زیر پوشش بیشتر بوده و گرافیت پایه بیشتر اکسید می شود و درصد کاهش وزن افزایش می یابد [۲۲]. همچنین در شکل ۶ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) سطح مقطع پوشش ها نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود گرافیت پایه نمونه پوشش ثانویه کاملا حفظ شده و ساختار تدریجی هنوز برقرار است اما بخشی از گرافیت پوشش ثانویه اکسید شده است و ایجاد عیب لایه ای شدن (Delamination) را نشان می دهد که می تواند ناشی از



شکل ۲: SEM مقطع پوشش ها پس از اکسیداسیون به مدت ۱۰ h.

تنش حرارتی حاصل از اختلاف ضریب انبساط حرارتی پوشش α ارتی حاصل از اختلاف ضریب انبساط حرارتی پوشش SiO₂ (($(1^{\circ}C)$) $^{\circ}$ -۱۰×۵/۹=۵) باشد ($(1^{\circ}C)$]. وقتی پوشش SiO₂ ($(1^{\circ}C)$) $^{\circ}$ -۱۰×۵/۹=۵) باشد ($(1^{\circ}C)$]. وقتی پوشش ار نسبتا نازک است، استحکام پیوندی خوبی با پایه دارد، اما با افزایش ضخامت آن، تنش حاصل از اختلاف ضریب انبساط حرارتی بیشتر می شود و در نهایت منجر به بروز عیب لایه ای شدن می شود ((T°)].

آنالیز پراش اشعه ایکس پوشش ها در شکل ۷ و آنالیز نیمه کمی در شکل ۸ آمده است. برای پوسته بجا مانده از پوشش اولیه، فاز غالب، فاز SiO₂ میباشد. اما در محصول اکسید شده پوشش ثانویه فاز غالب همچنان SiC است که در کنار آن فازهای ZrSiO₄ وZrSi و SiO حضور دارند.

اکسیداسیون پوشش ها، با پیشرفت واکنش های ذیل می تواند انجام شود:

R

به نظر مي آيد اكسيژن مي تواند از طريق خلل و فرج موجود در پوشش، به آن نفوذ کرده و طبق معادل ه ۱۳ و ۱۴ کربن موجود در پوشش واکنش دهد. بدین ترتیب کربن موجود در یوشش با تبدیل شدن به گازهای CO_(g) و CO_{2(g)} از پوشش خارج شده و حفراتی برای نفوذ بیشتر اکسیژن ایجاد مي شود، به همين ترتيب اكسيژن از طريق پوشش به پايه گرافیتی نفوذ کرده و سبب اکسیداسیون آن می شود. معادله ۱۳ و معادله ۱۴ با کاهش وزن قطعه همراه هستند که کاهش وزن در نتایج اکسیداسیون را می توان به آنها نسبت داد [۲۴]. همچنین با توجه به حضور فاز SiC در یوشش ها می توان بیان كرد كه اكسيژن در يوشش، طبق معادله ۱۵ و معادله ۱۶ با SiC واکنش داده و فاز SiO₂ را توليد مي کند. با توجه به اين کے دمیای ذوب فراز شیشیہای SiO₂ در محمدودہ °C ۱۹۵۰–۱۱۰۰ می باشد [۲۵]، فاز مذاب SiO₂ می تواند با نفوذ به درون خلل و فرج پوشش، آنها را پر کند و مانع نفوذ اکسیژن به یوشش شده و ضمن کنترل فر آیند اکسیداسیون با نفوذ اکسیژن از درون عیوب پوشش، از اکسیداسیون پوشش جلو گيرې مي شو د [۱۳].

تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنش های اکسیداسیون مطابق شکل ۹ نشان می دهد که کلیه واکنش ها دارای تغییرات انرژی آزاد گیبس منفی بوده و به طور خودبخود انجام پذیر هستند [۲۶]. همچنین به نظر می رسد در دماهای کمتر از ۵۰ ۱۵۰۰ به ترتیب فازهای SiC و C استعداد اکسیداسیون بیشتری دارند و در دمای ۲° ۱۵۰۰ فازهای SiC و C از اولویت اکسیداسیون مشابهی بر خوردار هستند.

در ادامه روند اکسیداسیون، فاز ZrO₂ در پوشش ثانویه می تواند طبق معادله ۱۷ با SiO₂ واکنش داده و فاز دیر گداز زیر کون (ZrSiO₄) را تشکیل دهد که از مقاومت به اکسیداسیون عالی در دماهای بالا و به مدت زمان طولانی برخوردار است [۲۷].

 $ZrO_2 + SiO_{2(1)} \rightarrow ZrSiO_4$ (1V)

همچنین شکل ۱۰ نشان میدهد نانوالیاف SiC در عیوب

$$2C + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{(g)} \tag{17}$$

$$C + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \tag{14}$$

$$SiC + 2O_{2(g)} \rightarrow SiO_2 + CO_{2(g)}$$
(10)

$$2SiC + 3O_{2(g)} \rightarrow 2SiO_2 + 2CO_{(g)}$$
(19)







شکل ۸: آنالیز نیمه کمی پوششها بر حسب درصد وزنی فازها.

R

محقق و مرجع	تغییر وزن (درصد)	زمان اکسیداسیون (ساعت)	دمای ترکیب پوشش (°C)		
				تو نيب پوشش	
تحقيق حاضر	_۵۸	۱.	10	SiC	
تحقيق حاضر	-9	۱۰	10	SiC/ZrO2-nano-SiC	
علىاكبرپور	_) •	٩	140.	SiC/Mullite	
علىاكبرپور	_4.	٩	140.	SiC	
[Y1]Zhao	_٩٠	۱۰	17	SiC	
[YY] Wang	_YX	٨	10	SiC/(ZrB ₂ -SiC)	

جدول ۲: مقایسه کلی نتایج آزمون اکسیداسیون همدمایی با پایه گرافیت.



شكل ۱۰: پلزني منافذ و حفرات توسط الياف SiC در پوشش ثانويه.

کار رود. در جدول ۲ نتایج آزمون اکسیداسیون همدمایی حاصل از پروژه حاضر با نتایج دیگران که در آنها پوشش مشابه بر پایه گرافیت اعمال شده است، مقایسه می شود. همانطور که ملاحظه می شود کاهش وزن قطعات با نانوالیاف SiC دارای نتایج بهتری نسبت به نتایج SiC و SiC/ZrB توسط دیگر محققین ارائه می دهد.

٤- نتیجه گیری

– اعمال پوشش اولیه با ترکیب SiC ،Si و Al₂O₃ و Al₂O₃ به روش
سمانتاسیون بسته ای، و نیز سنتز پوشش ثانویه با ترکیب ZrB₂
در PCS، ساختار تدریجی با تراکم مناسب و فاقد ترک
عمودی ایجاد می کند که دارای فاز غالب SiC β می باشد.
در هر نوع پوشش، نانو الیاف SiC با قطر کمتر از In
۱۰ میکرون تشکیل شدند. البته فراوانی



شکل ۹: تغییرات انرژی آزاد گیبس واکنشهای اکسیداسیون در فشار استاندارد atm ۱.

پوشش ثانویه و میکرو ترک، پلزنی (Bridging) کرده و در نتیجه از گسترش عیوب در حین تنش حرارتی جلوگیری میکند و مانع نفوذ اکسیژن به پایه گرافیتی از طریق خلل و فرج میشود. از اینرو مقاومت به اکسیداسیون مناسب برای پوشش ثانویه را می توان به حضور نانوالیاف SiC و تا حدودی فاز Ario ZrSiO نسبت داد [۷،۹]. به طوری که طبق جدول ۱ حضور نانوالیاف SiC با کاهش وزن قطعه در حدود ۶٪ نسبت به ۳۸٪ برای نمونه با پوشش بدون نانوالیاف SiC موجب افزایش شش برابری مقاومت به اکسیداسیون گرافیت در دمای ۲۰ ۱۵۰۰ شده است.

با توجه به آنکه کاهش وزن نمونه در روش آزمون اکسیداسیون علاوه بر شرایط پوشش، می تواند تابع عوامل متعددی نظیر ابعاد و هندسه نمونه، ابعاد کوره و شرایط محیطی اکسیداسیون باشد، لذا مقایسه نتایج می تواند به اکسیداسیون، تنها برای مقایسه نسبی حدود نتایج می تواند به مراجع

[1] J. Liu, C. Wang, L. Dong, T. Liang, *Nuclear Engineering* and *Technology*, **48**, 2016, 182.

[2] H. Jin, S. Meng, X. Zhang, Q. Zeng, J. Niu, *Journal of the European Ceramic Society*, **36**, 2016, 1855.

[3] P. Morgan, "*Carbon fibers and their composites*", taylor& Francis Boca Raton, FL2005.

[4] J. Ren, Y. Zhang, H. Hu, T. Fei, H. Li, *Applied Surface Science*, **360**, 2016, 970.

[5] T. Feng, H. Li, M. Hu, H. Lin, L. Li, Journal of Alloys and Compounds, 662, 2016, 302.

[6] H.J. Li, Y.L. Zhang, Q.G. Fu, K.Z. Li, J. Wei, D.S. Hou, *Carbon*, **45**, 2007, 2704.

[7] W.Z. Zhang, Z. Yi, L. Gbologah, X. Xiong, *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, **21**, 2011, 1538.

[8] H. Jafari, N. Ehsani, S. Khalifeh-Soltani, M. Jalaly, *Applied Surface Science*, **264**, 2013, 128.

[9] Y. Chu, H. Li, Q. Fu, H. Wang, X. Hou, X. Zou, G. Shang, *Carbon*, **50**, 2012, 1280.

[10] Y. Zhang, Z. Hu, B. Yang, J. Ren, H. Li, *Ceramics International*, **41**, 2015, 2582.

[11] P. Wang, C. Zhou, X. Zhang, G. Zhao, B. Xu, Y. Cheng, P. Zhou, W. Han, *Ceramics International*, 42, 2016, 2654.

[12] J.F. Shackelford, W. Alexander, "CRC materials science and engineering handbook", CRC press 2000.

[13] X. Yang, Y. Zou, Q.Z. Huang, Z.A. Su, X. Chang, M.Y. Zhang, Y. Xiao, *Journal of Central South University of Technology*, **17**, 2010, 1.

[14] F. Chung, J. of Applied Crystallography, 7, 1974, 519.

[15] A. Roine, Outokompu Research Oy, Pori, Finland, 2006.

[16] O. Paccaud, Le Journal de Physique IV, 5, 1995, 135.

[17] O. Paccaud, Chemical Vapor Deposition, 6, 2000, 41.

[18] R. Yao, Z. Feng, Y. Yu, S. Li, L. Chen, Y. Zhang, *Journal of the European Ceramic Society*, **29**, 2009, 2079.

[19] Y.L. Zhang, H.J. Li, Q.G. Fu, K.Z. Li, J. Wei, P.Y. Wang, Surface and Coatings Technology, 201, 2006, 3491.

[20] ISO/TC229, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2011.

[21] J. Zhao, G. Wang, Q. Guo, L. Liu, Fusion Engineering and Design, 82, 2007, 363.

[22] P. Wang, W. Han, X. Zhang, N. Li, G. Zhao, S. Zhou, *Ceramics International*, **41**, 2015, 6941.

[23] O.S. Kwon, S.H. Hong, H. Kim, *Journal of the European Ceramic Society*, **23**, 2003, 3119.

[24] F. Tao, L. He Jun, S. Xiao Hong, Y. Xi, W. Shao Long, *Corrosion Science*, **67**, 2013, 292.

[25] Y.L. Zhang, H.J. Li, X.Y. Yao, K.Z. Li, S.Y. Zhang, *Surface and Coatings Technology*, **206**, 2011, 492.

[26] D.R. Gaskell, "Introduction to the Thermodynamics of Materials", 4th, Taylor and Francis, New York, 2003.

[27] A. Kaiser, M. Lobert, R. Telle, *Journal of the European Ceramic Society*, **28**, 2008, 2199.

نانوالیاف SiC در پوشش ثانویه بیشتر بود که قطر نانوالیاف SiC آن در حدود nm ۷۰– ۵۰ می باشد که تشکیل درجا SiC به واکنش گازی SiO و CO نسبت داده می شود. – پس از آزمون اکسیداسیون در دمای C^o ۱۵۰۰ و زمان ۱۰ ساعت، از نمونه پوشش اولیه پوسته با کمی هسته گرافیتی با فاز غالب SiO₂ باقی ماند ولی نمونه پوشش ثانویه ضمن برخورداری از دوام مناسبی دارای فاز غالب β-SiC بود. – بررسی تغییر وزن نمونه ها پس از اکسیداسیون همدمایی

- بررسی نعیر ورن نمونه ها پس از اکسیداسیون همدمایی نشان داد که حضور نانوالیاف SiC تاثیر بسزایی در مقاومت به اکسیداسیون پوشش ها دارد. در حالی که گرافیت پایه بدون پوشش در زمان حدود یک ساعت اکسید شد، کاهش وزن نمونه با پوشش اولیه در حدود ۲۸٪ و نمونه با پوشش وزن نمونه با پوشش اولیه در حدود ۹۸٪ و نمونه با پوشش ثانویه حاوی نانوالیاف SiC تنها حدود ۹٪ بود که علت بر تری آن به حضور نانوالیاف SiC با مکانیزم پلزنی در منافذ و حفرات و تا حدودی تشکیل فاز دیر گداز ZrSiO4 نسبت داده شد.

سیاسگزاری

بر خود لازم میدانیم صمیمانه ترین سپاس ها را نشار بزرگوارانی که با بذل عنایت و همکاری خود، ما را مرهون لطف خویش ساختهاند، قرار دهیم، بویژه سید علی خلیفه سلطانی که با رهنمودهای بی دریخ و عالمانه و یادآوری نکات ظریف، ما را در تدوین این تحقیق راهنمایی کردند و محمود احمدزاده که همکاری بسیاری در تهیه دستگاهها و انجام آزمایش ها با بنده داشتهاند.